

## JACA No.43-2006

### クリーンルームにおける基板表面汚染物質の測定方法指針

1. 適用範囲
2. 引用規格
3. 定義
  - 3.1 表面
  - 3.2 基板
  - 3.3 表面付着粒子計数器
4. 対象とする基板と汚染物質
  - 4.1 対象基板
  - 4.2 対象汚染物質
  - 4.3 測定方法の概要
5. 粒子の測定の流れと計画
  - 5.1 基板表面の準備
  - 5.2 測定手順及び方法
  - 5.3 定量方法
  - 5.4 結果の表示
  - 5.5 測定における留意点
6. 分子状物質の測定の流れと計画
  - 6.1 有機物質の測定
  - 6.2 酸性及び塩基性物質の分析
  - 6.3 金属の分析
7. ブランク低減手法
  - 7.1 測定対象基板とブランク低減対象汚染物質
  - 7.2 基板のブランク低減
  - 7.3 測定におけるブランク低減
  - 7.4 前処理・分析環境のブランク低減
8. 精度の検証方法
  - 8.1 精度検証項目
  - 8.2 精度の検証
  - 8.3 精度検証方法の参照規格
9. 結果の報告事項
  - 附属書1 対象基板表面と測定方法
  - 附属書2 表面脱離粒子の測定
    1. 概要
    2. 適用範囲
    3. 装置
    4. 準備
    5. 手順
    6. 結果の表示
    7. 注意事項
  - 附属書3 基板のコンデイショニング操作
    1. 適用範囲
    2. コンデイショニング操作
      - 2.1 初期コンデイショニング
      - 2.2 仕上げコンデイショニング
    3. コンデイショニング上の注意事項
  - 附属書4 基板表面の総汚染有機物量の算出方法
    1. 本指針で定める基板表面の総汚染有機物量の算出方法
    2. 他の規格で定められている基板表面の総汚染有機物量の算出方法
- 解説1 分析法の概略
  1. 表面分析法について
  2. 分子状汚染の表面分析方法
- 解説2 質量濃度と原子・分子数濃度の関係
- 解説3 関連規格のリスト